

SAMPLE 検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/2

品名〈Model Name〉 (LCRハイテスタ〈LCR HiTESTER〉)
 形名〈Model Number〉 (3511)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 1999-0330559)
 検査年月日〈Test Date〉 (1999-03-11)
 (〈YYYY-MM-DD〉)
 検査条件〈Test Conditions〉 (24.0 °C, 40 %rh)
 測定信号レベル (1 Vrms)
 〈Measurement Signal Levels〉

レンジ 〈Range〉	周波数／モード 〈Freq/Mode〉	入力 〈Input〉	(標準器校正値) 〈Std. Cal. Value〉	許容範囲 〈Tolerance〉	表示値 〈Indicated Value〉
. 確度〈Accuracy〉					
100mΩ	120 Hz	Z	50mΩ (0.04953 Ω)	0.0476 Ω ~ 0.0515 Ω	(0.0500 Ω)
		θ	(-0.017 °)	-1.93 ° ~ 1.90 °	(0.00 °)
	1kHz	Z	50mΩ (0.04955 Ω)	0.0476 Ω ~ 0.0515 Ω	(0.0500 Ω)
		θ	(-0.024 °)	-1.94 ° ~ 1.89 °	(0.00 °)
1 Ω	120 Hz	Z	500mΩ (0.49733 Ω)	0.4884 Ω ~ 0.5062 Ω	(0.5000 Ω)
		θ	(-0.028 °)	-1.02 ° ~ 0.97 °	(0.00 °)
	1kHz	Z	500mΩ (0.49730 Ω)	0.4884 Ω ~ 0.5062 Ω	(0.5000 Ω)
		θ	(0.002 °)	-0.99 ° ~ 1.00 °	(0.00 °)
10 Ω	120 Hz	Z	5 Ω (5.00299 Ω)	4.9855 Ω ~ 5.0205 Ω	(5.0000 Ω)
		θ	(-0.027 °)	-0.20 ° ~ 0.15 °	(0.00 °)
	1kHz	Z	5 Ω (5.00286 Ω)	4.9854 Ω ~ 5.0203 Ω	(5.0000 Ω)
		θ	(-0.003 °)	-0.18 ° ~ 0.17 °	(0.00 °)
100 Ω	120 Hz	Z	50 Ω (49.9987 Ω)	49.959 Ω ~ 50.038 Ω	(50.000 Ω)
		θ	(-0.027 °)	-0.10 ° ~ 0.05 °	(0.00 °)
	1kHz	Z	50 Ω (49.9980 Ω)	49.959 Ω ~ 50.037 Ω	(50.000 Ω)
		θ	(-0.003 °)	-0.08 ° ~ 0.07 °	(0.00 °)
1kΩ	120 Hz	Z	500 Ω (499.864 Ω)	499.47 Ω ~ 500.26 Ω	(500.00 Ω)
		θ	(-0.026 °)	-0.07 ° ~ 0.02 °	(0.00 °)
	1kHz	Z	500 Ω (499.850 Ω)	499.46 Ω ~ 500.24 Ω	(500.00 Ω)
		θ	(-0.003 °)	-0.05 ° ~ 0.04 °	(0.00 °)

総合判定〈Overall Result〉

(PASS)

検査者〈Inspected by〉

()

承認者〈Approved by〉

()

SAMPLE 検査成績表
<TEST REPORT>

2/2

製造番号<Serial No.> (No. 1999-0330559)
検査年月日<Test Date> (1999-03-11)
<YYYY-MM-DD>

レンジ <Range>	周波数／モード <Freq/Mode>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度<Accuracy>					
10k Ω	120 Hz	Z	5k Ω (4.99265 k Ω)	4.9872 k Ω ~ 4.9981 k Ω (4.9950 k Ω)	
		θ	(-0.026 °)	-0.10 ° ~ 0.05 ° (0.00 °)	
	1kHz	Z	5k Ω (4.99259 k Ω)	4.9871 k Ω ~ 4.9980 k Ω (4.9950 k Ω)	
		θ	(-0.003 °)	-0.08 ° ~ 0.07 ° (0.00 °)	
100k Ω	120 Hz	Z	50k Ω (50.0001 k Ω)	49.931 k Ω ~ 50.070 k Ω (50.000 k Ω)	
		θ	(-0.027 °)	-0.12 ° ~ 0.07 ° (0.00 °)	
	1kHz	Z	50k Ω (49.9993 k Ω)	49.930 k Ω ~ 50.069 k Ω (50.000 k Ω)	
		θ	(-0.009 °)	-0.10 ° ~ 0.09 ° (0.00 °)	
1M Ω	120 Hz	Z	500k Ω (499.858 k Ω)	498.36 k Ω ~ 501.35 k Ω (500.00 k Ω)	
		θ	(-0.032 °)	-0.22 ° ~ 0.15 ° (0.00 °)	
	1kHz	Z	500k Ω (499.843 k Ω)	498.35 k Ω ~ 501.34 k Ω (500.00 k Ω)	
		θ	(-0.027 °)	-0.21 ° ~ 0.16 ° (0.00 °)	

項目 <Item>	周波数 <Frequency>	設定 <Set Value>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
測定信号レベル	120 Hz	50 mV	0.040 V ~ 0.060 V (0.050 V)	
<Measurement	120 Hz	500 mV	0.445 V ~ 0.555 V (0.500 V)	
signal level>	120 Hz	1 V	0.895 V ~ 1.105 V (1.000 V)	
	1 kHz	50 mV	0.040 V ~ 0.060 V (0.050 V)	
	1 kHz	500 mV	0.445 V ~ 0.555 V (0.500 V)	
	1 kHz	1 V	0.895 V ~ 1.105 V (1.000 V)	
測定周波数	120 Hz		119.988 Hz ~ 120.012 Hz (120.000 Hz)	
<Measurement	1 kHz		0.99990 kHz ~ 1.00010 kHz (1.00000 kHz)	
frequency>				

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。
<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>